

Diffractomètre PANALYTICAL X'pert Pro MPD

Anode Co (6,9 keV)

Cet instrument autorise de multiples configurations. Il est essentiellement dédié à l'analyse qualitative d'échantillons polycristallins sous forme de poudres (identification de phases) dans des conditions classiques ou sous atmosphère contrôlée. Il permet également la recherche des paramètres de maille, l'affinement de structures et l'analyse quantitative par la méthode de Rietveld.

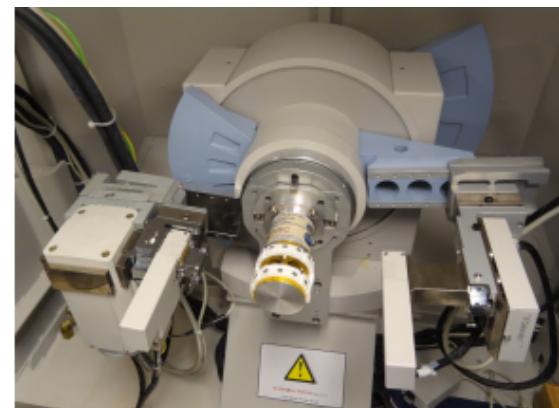
Equipé d'une anode de cobalt, cet appareil est particulièrement utilisé pour étudier des matériaux contenant du fer en conditions d'anaérobie.

Spécificités :

- Tube scellé avec anode en cobalt.
- Goniomètre 2-cercles θ - θ .
- Détecteur linéaire rapide X'Celerator.
- Monochromateur arrière.
- Mesure en géométrie Bragg-Brentano pour les analyses conventionnelles en réflexion sur porte échantillon plan.
- Support d'échantillon en silicium monocristallin permettant l'analyse de faibles quantités en réflexion.
- Mesures en transmission (Debye-Scherrer) sur capillaires (faisceau parallèle avec miroir de Goebel).
- Fentes de Sollers 0,04 ou 0,02°, fentes de divergence programmables (1/2 à 1/32°)
- Passeur automatique 15 positions.
- Mesures sous atmosphère contrôlée dans une chambre développée à l'IMPMC.



Passeur d'échantillon automatique



Echantillon en atmosphère contrôlée